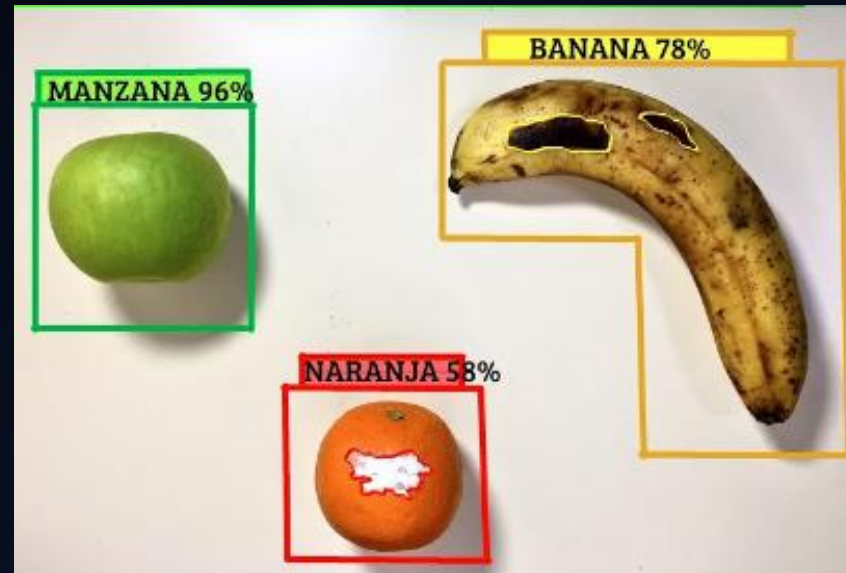


APLICACIÓN INDUSTRIAL DE DETECCIÓN DE DEFECTOS EN LA FRUTA



ABEL HARO ARMERO

OBJETIVOS

- Generación y clasificación de imágenes
- Selección del mejor modelo neuronal
- Entrenamiento y reentrenamiento para mejorar la precisión
- Optimización para Nvidia Jetson Xavier
- Evaluar en un entorno de condiciones similares

POSIBLES PROBLEMAS

- Calidad y cantidad de datos
 - Desbalanceo de clases
 - Variabilidad de los defectos en tamaño, forma, color y ubicación
 - Interferencias ambientales, reflejos o sombras
 - Partes no visibles
 - Diferentes formatos de entrada según arquitectura de red neuronal
- Sobreajuste del modelo
 - Dificultad para generalizar nuevos defectos
- Limitaciones de hardware
 - Conste computacional
 - Latencia en inferencia
- Condiciones de prueba de un entorno industrial
 - Iluminación y movimiento